

- /67** Úvodník
- /68** T. Prnka / **Sekce „Nanovědy a nanotechnologie“ České společnosti pro nové materiály a technologie**
- /70** T. Šikola / **Nanotechnologie – vize či skutečnost?**
- /75** P. Tománek / **Krása evanescentních vln**
- /79** P. Klapetek, I. Ohlídal / **Srovnání snímků NSOM a AFM při studiu vybraných objektů**
- /82** P. Sobotík, P. Kocán, I. Ošťádal / **Použití STM pro přímá pozorování atomárních procesů na systému Ag/Si(111)7×7**
- /86** H. Pelouchová, P. Janda, J. Weber / **Studium reakce přenosu náboje na TiO₂ s nanometrovým rozlišením metodami STS a STM**
- /89** R. Kalousek, D. Škoda, F. Lopour a kol. / **Simulace zobrazení povrchů pomocí bezkontaktní metody AFM**
- /93** T. Mates, A. Fejfar, I. Drbohlav a kol. / **Studium struktury a růstu nízkoteplotního protokrystalického křemíku pomocí AFM mikroskopu**
- /97** I. Ohlídal, P. Klapetek, D. Franta / **Aplikace mikroskopie atomové síly při analýze tenkých vrstev ZnSe a ZnTe**
- /101** Z. Strýhal, J. Pavlík, S. Novák / **Studium povrchu plazmaticky oxidovaných tenkých vrstev cínu pomocí AFM**
- /105** D. Škoda, F. Lopour, R. Kalousek a kol. / **Aplikace AFM v oblasti přípravy a studia nanostruktur**
- /109** R. Kubínek, M. Vůjtek, Z. Zapletalová a kol. / **Biologické aplikace AFM**
- /113** P. Fojtík, A. Svoboda, T. Mates a kol. / **Experimentální aspekty luminiscence/fotonové emise buzené hrotem STM**
- /117** D. Košťálová / **Lokální spektroskopie luminiscence polovodičových struktur**
- /120** Š. Lányi / **Hranice přímé měřitelnosti koncentracie dopantu v polovodičových strukturách rastrovacím kapacitním mikroskopem**
- /124** M. Šiler, P. Klapetek, I. Ohlídal / **Mikroskopie magnetické síly: aplikace při studiu pevných disků**
- /128** J. Weber, H. Pelouchová, P. Janda / **Tunelová mikroskopie a spektroskopie v elektrochemii**